

ICS 31.220  
L 23



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 5095.8—1997  
idt IEC 512-8:1993

GB/T 5095.8—1997

## 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第8部分:连接器、接触件及引 出端的机械试验

Electromechanical components for electronic equipment  
Basic testing procedures and measuring methods  
Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical  
tests on contacts and terminations

中华人民共和国  
国家标准  
电子设备用机电元件  
基本试验规程及测量方法  
第8部分:连接器、接触件及引  
出端的机械试验  
GB/T 5095.8—1997

\*  
中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 www.bzcb.com  
电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*  
开本 880×1230 1/16 印张 1.5 字数 41 千字  
1998年7月第一版 2005年8月第二次印刷

\*  
书号:155066·1-23452 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533



GB/T 5095.8—1997

1997-12-26 发布

1998-10-01 实施

国家技术监督局 发布

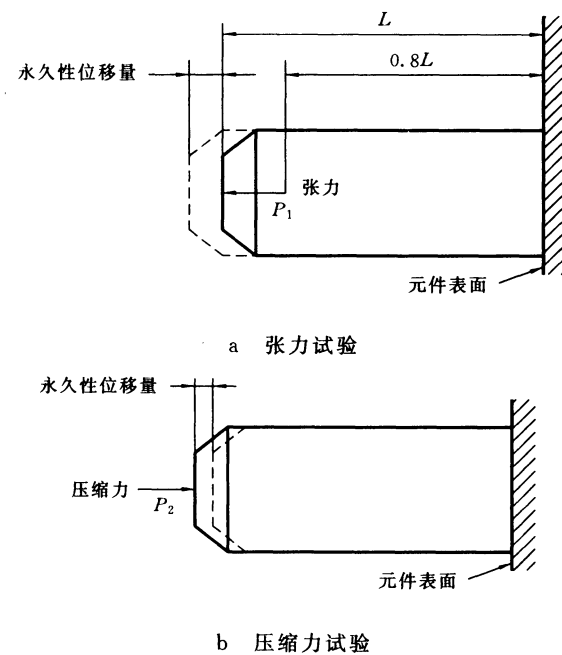


图 14 试验方法

## 3.15.4 要求

永久性位移应不超过详细规范的规定值。

阳插片应不产生松动,而元件应无损伤。

## 3.15.5 需要规定的细节

详细规范要求本项试验时应规定下列细节:

- 试验样品的准备和安装要求;
- 施加力的方向;
- 要施加的张力或压缩力的值;
- 允许的阳插片的最大位移量;
- 与标准试验方法有何不同之处。

## 3.16 试验 16r: 模拟阳接触件在连接器绝缘安装板中的偏移

## 3.16.1 目的

是确立详细的标准试验方法,以测定模拟的阳接触件在其孔眼中的偏移量。

## 3.16.2 试验样品准备

将连接器安装在合适的试验装置上。

试验样品应有装阳接触件的绝缘安装板。

试验针(标准规)应进入接触件孔眼中(见图 15)。利用详细规范规定的阳接触件的关键尺寸设计试验针。

应不配接附件。

## 3.16.3 试验方法

## 3.16.3.1 每种接触件号的试验数目

除详细规范另有规定,每种接触件孔眼数的 10% 应进行试验,至少应有一个接触件孔眼。

## 3.16.3.2 条件试验

试验样品应不插合。

## 3.16.3.3 试验程序

应按图 15 所示,以不超过 10N/s 的速度施加详细规范中规定的力,并应保持 10s。

## 前 言

本标准等同采用 IEC 512-8:1993《电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第 8 部分:连接器、接触件及引出端的机械试验》,是对 GB 5095.8—86 进行的第一次修订。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由全国电子设备用机电元件标准化技术委员会归口。

本标准由电子工业部标准化研究所负责起草。

本标准主要起草人:余玉芳、汪其龙、张菊华、王玉堂。

## IEC 前言

1) IEC(国际电工委员会)是由各国家电工委员会(IEC 国家委员会)组成的世界性标准化组织。IEC 的目的是促进电工电子领域标准化问题的国际合作。为此目的,除其他活动外,IEC 发布国际标准。国际标准的制定由技术委员会承担,对所涉及内容关切的任何 IEC 国家委员会均可参加国际标准的制定工作。与 IEC 有联系的任何国际,政府和非官方组织也可以参加国际标准的制定。IEC 与国际标准化组织(ISO)根据两组织间协商确定的条件保持密切的合作关系。

2) IEC 在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

3) 这些决议或协议以标准,技术报告或导则的形式发布,以推荐的形式供国际上使用,并在此意义上,为各国家委员会认可。

4) 为了促进国际上的统一,各 IEC 国家委员会有责任使其国家和地区标准尽可能采用 IEC 标准。IEC 标准与相应国家或地区标准之间的任何差异应在国家或地区标准中指明。

国际标准 IEC 512-8 由 IEC/TC 48(电子设备用机电元件和机械结构)制定的。

本标准第三版取代了 1984 年出版的第二版及其修订 1(1985 年)并构成技术修订。

本标准与第 1 部分:总则(IEC 512-1)一同使用。

整套标准包括的其他试验项目在 IEC 512-1 的附录 A 中给出了总的计划。这些试验项目在制定后就发布。

整套标准预定将替代 IEC 130-1 中的试验项目。

本标准文本以 1984 年出版的第二版 IEC 512-8 及修订 1(1985 年)和下列文件为依据:

DIS	表决报告
48(C.O.)317	48(C.O.)320
48(C.O.)316	48(C.O.)323

表决批准本标准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅。

### 3.14 试验 16p: 固定的阳插片抗扭强度

#### 3.14.1 目的

是确立详细的标准试验方法,以评定固定的阳插片及其固定部分耐受规定扭矩的能力。

#### 3.14.2 试验样品准备

试验样品应由装配有一个或多个阳插片的元件组成。

应按详细规范准备和安装试验样品。

#### 3.14.3 试验方法

按规定方向将规定扭矩施加到固定的阳插片上。示例如图 13 所示。扭矩应平稳增加到规定的值并保持 1min。应卸除所施加的扭矩并测定阳插片的永久性位移量。永久位移量为扭矩施加平面中阳插片的初始位置和最终位置的差,以及固定部分(如果适用)的初始位置和最终位置的差。

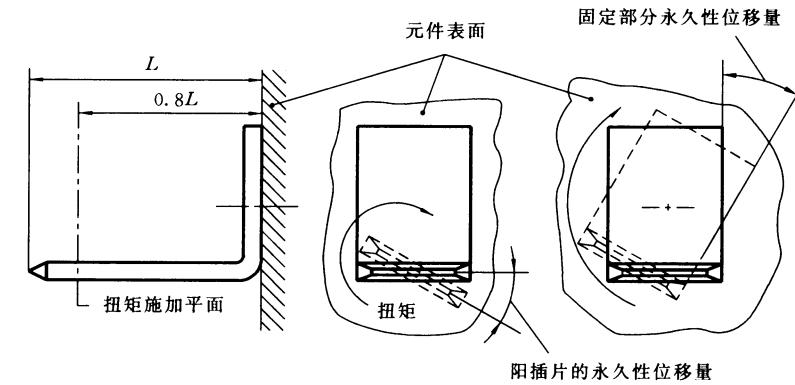


图 13 施加力矩示例

#### 3.14.4 要求

阳插片及其固定部分的永久性位移量应不超过详细规范的规定。

阳插片应不产生松动,而元件应无损伤。

#### 3.14.5 需要规定的细节

详细规范要求本项试验时应规定下列细节:

- 试验样品的准备和安装要求;
- 扭矩方向;
- 要施加的扭矩值;
- 允许的阳插片的最大永久性位移;
- 允许的固定部分的最大永久性位移;
- 与标准试验方法有何不同之处。

### 3.15 试验 16q: 固定的阳插片抗张力和抗压缩强度

#### 3.15.1 目的

是确立详细的标准试验方法,以评定固定的阳插片及其固定部分耐受规定的张力和(或)压缩力的能力。

#### 3.15.2 试验样品准备

试验样品应由装配有一个或多个阳插片组成。

应按详细规范准备和安装试验样品。

#### 3.15.3 试验方法

张力  $P_1$  或压缩力  $P_2$  应按详细规范规定施加到固定的阳插片上,如图 14 所示。力应平稳增加到规定值并保持 1min。应卸除所施加的力并测定阳插片的永久性位移量。该位移量应为阳插片顶端的初始位置和最终位置的差。对于张力和压缩试验应采用不同的试验样品。